


<b>Search Notes</b> 	<b>Application/Control No.</b> 10592025	<b>Applicant(s)/Patent Under Reexamination</b> LEE ET AL.
	<b>Examiner</b> DENE QUEST	<b>Art Unit</b> 3728

### SEARCHED

Class	Subclass	Date	Examiner
206	219, 221, 222, 568, 528, 532, 445	9/15/2009	DQ
215	2, 288, DIG 8	9/15/2009	DQ
220	520, 521	9/15/2009	DQ
222	80, 83, 532, 536, 525, 138, 145.1, 541.1	9/16/2009	DQ
426	86	9/21/2009	DQ
220	502, 521, 522	5/04/2010	DQ
215	6	5/03/2004	DQ
222	145.5	5/03/2010	DQ
206	219, 222	4/30/2010	DQ

### SEARCH NOTES

Search Notes	Date	Examiner
Inventor Search	9/15/2009	DQ
Plus Search	9/15/2009	DQ
East Search	9/15/2009	DQ
Stephen Garbe	9/21/2009	DQ
Frederick Nicolas for Search in 222	9/24/2009	DQ
Geg Pickett	4/23/2010	DQ
Niki Eloshway for Search in 220 and 215	4/30/2010	DQ
East Search	5/03/2010	DQ
Interference Search	5/04/2010	DQ

### INTERFERENCE SEARCH

Class	Subclass	Date	Examiner
206	219, 221, 222, 568, 528, 532, 445	5/04/2010	DQ
215	2, 288, DIG 8, 6	5/04/2010	DQ
220	502, 520, 521, 522	5/04/2010	DQ
222	80, 83, 532, 536, 525, 138, 145.1, 541.1, 145.5	5/04/2010	DQ

--	--